

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.	(11) 공개번호	특 1990-0013608
H01L 21/66	(43) 공개일자	1990년 09월 06일
(21) 출원번호	특 1989-0002458	
(22) 출원일자	1989년 02월 28일	
(71) 출원인	도오교오 에레구토론 가부시끼가이샤, 고다까 도시오	
	일본	
(72) 발명자	일본국 도오교오도 신쥬구구 니시신쥬구 1초오메 26번 2고	
	이또야마 타케도시	
	일본	
(74) 대리인	일본국 도오교오도 신쥬구구 니시신쥬구 1초오메 26번 2고 도오교오 에레구토론 가부시끼가이샤 내	
	강동수	
	강일우	
(77) 심사청구	없음	
(54) 출원명	프로우버 장치	

요약

내용 없음

표도

3

공세서

발명의 명칭]

프로우버 장치

[도면의 간단한 설명]

제 3도는 본 발명의 테스트 헤드 얹어쓰는형 웨이퍼 프로우버 장치를 부분적으로 나타난 도면.

제 4도는 본 발명의 프로우버 장치에 사용되는 테스트 헤드 프로우브 카이드의 다른 형태를 나타난 도면.

제 5도는 본 발명의 웨이퍼 프로우버 장치의 동작을 설명하기 위한 도면.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

참고문헌

청구항 1.

테스트 신호를 발생하는 테스트 헤드 수단(26)과, 상기 테스트 헤드 수단(26)에 붙이고 때가 자유롭게 고정되고, 테스트 피스와 전기적을 접촉함으로써, 상기 테스트 피스에 상기 테스트 신호를 입력하며, 상기 테스트 피스의 전기적 특성을 테스트 하기위한 프로우브 카이드 수단(32)으로 이루어지는 프로우버 장치.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 프로우브 카이드 수단(32)이, 상기 테스트 헤드 수단(26)에 나사못을 되어 있는 프로우버 장치.

청구항 3.

테스트 헤아 할 반도체 웨이퍼를 얹어놓는데(37a)가 형성된 프로우브 기구부(22)와, 상기 웨이퍼와 전기적으로 접촉함으로써 상기 웨이퍼의 전기적 특성을 테스트하기 위한 프로우브 얹이 형성된 프로우브 카이드 수단(32)과 테스트의 지령에 의하여 테스트 신호를 발생하고, 이것을 상기 프로우드 카이드(32)를 통하여 상기 웨이퍼에 입력되는 테스트 헤드(26)로서, 상기 테스트 헤드(26)는, 상기 프로우브 카이드 수단(32)를 붙이고, 때가 자유롭게 고정함과 동시에 이것과 전기적으로 접촉하고 있고 또한, 상기 웨이퍼와 프로우드 카이드(32)와의 위치 맞춤을 행하기 위한 위치맞춤기구(37)로 이루어져서, 반도체 웨이퍼에 형성된, 접의 전기적 특성을 테스트 하기 위한 프로우버 장치.

청구항 4.

제 3항에 있어서, 테스트 헤드(26)는, 그의 아래면에, 상기 프로우드 카이드(32)를 직접 고정하고, 이것과 직접 전기적으로 접촉하는 퍼포먼스 보오드(31)를 가지는 프로우버 장치.

청구항 5.

제 4항에 있어서, 상기 퍼포먼스 보오드(31)와 상기 프로우브 카이드 수단(32)는, 나사(33)에 의하여 고정되어 있는 프로우버장치.

청구항 6.

제 4항에 있어서, 상기 퍼포먼스 보오드(31)와 상기 프로우브 카이드 수단(32)은, 서로 평행한(34)에 의해 고정되어 있는 프로우버 장치.

청구항 7.

제 4항에 있어서, 상기 퍼포먼스 보오드(31)와 프로우브 카이드 수단(32)는, 토고 핀(34)에 의하여 간격적으로 접촉되어 있는 프로우버 장치.

청구항 8.

제 5항에 있어서, 상기 퍼포먼스 보오드(31)와 상기 프로우브 카이드 수단(32)는, 각각 콘택트 패드(41), (42)를 가지고, 이들 콘택트 패드(41), (42)의 접촉에 의하여 상기 퍼포먼스 보오드(31)와 프로우브 카이드 수단(32)가 전기적으로 접촉하는 프로우버 장치.

청구항 9.

제 3항에 있어서, 상기 위치맞춤 기구(37)는, 상기 프로우브 카이드 수단(32)을 이동시키지 않고, 얹어놓는데(37a)를 X, Y, z 및 θ 방향으로 이동시키는 프로우버 장치.

청구항 10.

제 3항에 있어서, 상기 테스트 헤드(26)는, 상기 프로우브 기구부(22)의 상부에 대하여 위치 되었을때에 프로우브 카이드 수단(32)가 웨치퍼와 접촉하도록 프로우브 기구부(22)에 회전운동이 자유롭게 설치되어 있는 프로우버 장치.

청구항 11.

제 3항에 있어서, 상기 테스트 헤드(26)는, 핀 일렉트로닉스보오드를 수용하기 위한 홀(26a)을 가지고, 그 홀(26a)의 앞쪽끝단이 돌출하고, 그 돌출부에 프로우브 카이드 수단(32)이 고정되어 있는 프로우버장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면 3



